XD:X-ray Diffractometer

对应工业环境测定标准•工业环境评价标准修订

X 射线衍射装置 XRD-6000 环境测定包

适于工业环境中的游离硅以及石棉的定性•定量分析。

在劳动安全卫生法中,关于因劳动者在工作中的暴露而对 其造成健康损害的 92 种物质,规定必须实施其作业环境的 测定。其中,粉尘中的游离硅以及石棉的定性•定量分析可 以使用 X 射线衍射装置。最近因相关法规的修订,对有害 物质的管理浓度、分析程序进行了修改。

本测定包配备了依据「基底标准吸收校正法」的样品台和 定量软件,这不仅是使用 X 射线衍射装置 XRD-6000 对收集 在滤纸上的工业环境测定中的游离硅、石棉进行定性分析 需要的,在这些微量样品的定量分析中也是必备的。



游离硅的定性•定量分析

工业环境测定中矿物性粉尘的管理浓度为按以下公式计算出的量。(从 2005 年 4 月 1 日开始实行)

E=3.0/(0.59Q+1) (参考)修订前E=2.9/(0.22Q+1)

E: 管理浓度mg/m³ Q: 游离硅含有率 (%)

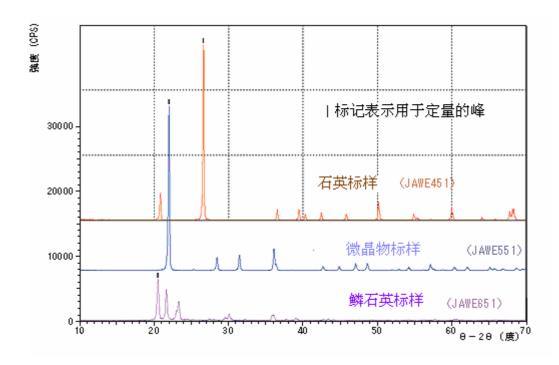
所以知道粉尘中游离硅酸的含有率是很重要的。游离硅种类有石英、微晶物、鳞石英等。

在此回修订中,首先规定使用 X 射线衍射装置掌握含有什么种类的游离硅(定性分析),根据其定性结果,以使用磷酸法或 X 射线衍射装置的基底标准吸收校正法进行定量。

下图表示这些游离硅的衍射模式,分别具有各自的特征峰,因此,易于识别其种类。

目标物质的衍射 X 射线强度因受基底物质吸收的影响,必须进行校正。为进行校正必须求得基底物质的 X 射线吸收系数。可在一次的测定中将其完成的方法就是「基底标准吸收校正法」。本测定包包括采用了此基底吸收校正法的专用定量分析软件。

各種游离硅的衍射模式



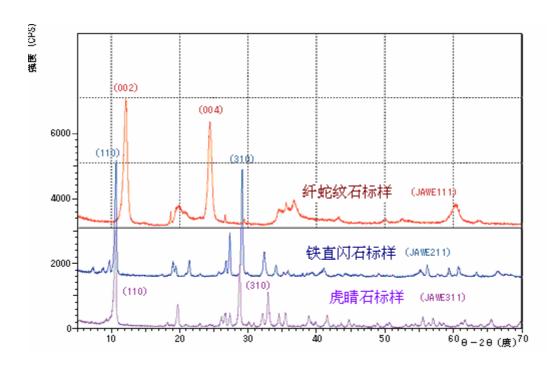
石棉的定性•定量分析

关于石棉,在 2005 年 7 月实施了【石棉伤害预防规则】。适用此规则的建材等样品,如果其石棉含量超过重量 5%左右以上,则可使用 X 射线衍射装置以标准添加法或内标添加法对采集来的样品进行定量,但对于少于上述含量的样品有时不能进行定量。

此时,作为只溶解样品基底成分的前处理方法,实施甲酸前处理法,然后使用 X 射线衍射装置以基底标准吸收校正法进行定量。

在石棉的定性·定量分析中,也可使用配备有基底标准吸收校正法的环境测定样品台的 X 射线衍射装置 XRD-6000 环境测定包。

各种石棉的衍射模式



石棉主要有蛇纹石类的纤蛇纹石,角闪石类的铁直闪石、虎睛石等。使用 X 射线衍射法利用它们的特征峰进行定量分析。

环境测定包

配置

1.	X射线衍射	対装置 XRD-6000(2kW, NF Cu 管球)	1套
2.	. 石墨单色仪(CM-3121)		
3.	. 环境测定样品台(RS-2001)		1 套
	【规格】	•旋转样品台	
		·基底标准吸收校正用滤片架(Zn)	
		•环境定量软件	

4. 冷却水循环装置

1套

选配件

- 1. 基底标准吸收校正用滤片架(A1)
- 2. ICDD 数据库(PDF2 CD-ROM)
- 3. PDF2 检索软件